

NUBIC 知的財産情報開示

開示日：2016年4月25日

各 位

NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。

技術移転等を御希望の場合は、ホームページの「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォームからお申込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。

[「NUBIC 技術シーズ案件申込」フォーム](#)：

[TOP](#)>[共同・受託研究](#)>[申込書／契約書](#)>[技術移転等をご希望の場合](#)>[WEB から](#)

出願番号 整理番号 担当者

表題	高温領域抽出装置		
発明の用途	太陽光発電の検査システムとして商品展開が考えられる。		
技術概要	本発明は、太陽電池のバイパス回路として設置された半導体の劣化を、発電機等の接続と太陽電池パネルの発熱観察により、簡便かつ効率的に感知するものである。		
発明の効果	本発明によれば、太陽光パネルが備えるバイパス回路の故障を検出する手間を低減することができる。		
技術分野	電気		
キーワード	太陽光発電, メンテナンス, 半導体		
国際特許分類	G01N 29/12		



【問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4 - 8 - 2 4 日本大学会館

TEL : 03-5275-8139 FAX : 03-5275-8328 E-mail : nubic@nihon-u.ac.jp